Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent und Reexamination	ler
10/748,981	JAAKKOLA ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Khai M. Nguyen	2617	

	SEAR	CHED	·
Class	Subclass	Date	Examiner
see	previous		KN
			•
			٠
	İ		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		-	
<u> </u>			

(INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
		DATE	EXMR
,			
see previous			KN
			,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	•		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	